# Mg K 吸収端での Al-Mg 合金の ASAXS 測定 Anomalous SAXS of Al-Mg alloys at K aborption edge of Mg

奥田浩司<sup>1,\*</sup>, 浴畑嶺<sup>1</sup>, 北島義典<sup>2</sup>、為則祐輔<sup>3</sup> Hiroshi OKUDA<sup>1,\*</sup>, Rei SAKOHATA<sup>1</sup>, Yoshinori KITAJIMA<sup>2</sup> and Yusuke TAMENORI<sup>3</sup>

<sup>1</sup>京都大学,〒606-8501 京都市左京区吉田本町 <sup>2</sup>高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光 〒305-0801 つくば市大穂 1-1 <sup>3</sup>高輝度光科学研究所 JASRI, 〒679-5198 兵庫県佐用郡光都 1-1

> <sup>1</sup>Kyoto University, Sakyo-ku Kyoto 606-8501, Japan
> <sup>2</sup> Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan
> <sup>3</sup>JASRI, Spring8, Sayo 679-5198, Japan

#### <u>1 はじめに</u>

構造用軽金属合金のうち、時効硬化性合金として 広く使用されている Al—Mg-X 合金のうち、Al-Mg2 元合金や Al-Mg-Si 合金では母相と析出物の電子密度 差が小さいため、ジュラルミンなどの析出過程の研 究で使われてきた X 線小角散乱法による評価が困難 であった。平均電子密度差の小さい析出物の評価、

例えば Fe-Cu 系などでは異常分散を利用した測定 (ASAXS)が用いられるが、Al-Mg 合金では吸収端 のエネルギーが約 1.3keV、いわゆる tenderX-rays の 領域にあるため、技術的な敷居がたかく、これまで あまり利用されていなかった。われわれはこのエネ ルギー領域をつかった軽合金の組織評価を実現する ため、蛍光体・FOT/CCD の構成の2次元検出器を導 入し、Al 合金の析出組織評価に必要な組織の異方性 を含めた評価を実現するための基礎検討を進めてき た。その結果まず Al の K 吸収端 (1.5keV)での異常 小角散乱測定に成功し[1]、今回さらに低エネルギー 側の Mg 吸収端での 2 次元小角散乱測定が半定量的 に実現できることが示された[2]。

#### <u>2. 方法</u>

Al 吸収端と比較して Mg 吸収端では低エネルギー であることから透過小角散乱測定に適した試料厚さ はさらに薄くなり、それに伴い標準試料の選定など にも課題があるものの、基本的には Al の吸収端での 測定で用いたシステムをそのまま利用した。

実験は BL11A に真空試料チャンバーと CCD 検出 器を持ち込んでおこなった。また、同じ装置をを用 い、SPring8 の BL27SU でも測定をおこなった。 BL27SU は入射光の輝度、サイズともに良好なため、 特に低角分解能と強度のダイナミックレンジが必要 な測定に利用した。透過光強度はフォトダイオード により検出した。角度校正はベヘン酸銀によってお こなった。試料はAl-,9,12,15mass%Mg合金を用い、 固相線直下の温度での長時間熱処理により均質化処 理をおこなった後、溶体化処理、氷水焼入れ後 313K での時効処理をおこなった。種々の熱処理時 間の試料に対して示差走査熱分析 (DSC)を行い、さ らに試料厚さを約20μmに研磨して小角散乱測定 用試料とした。

## 3. 結果と考察

313K での熱処理後の試料の DSC 測定より、最も 高濃度の15.8mass%Mg 試料では313K から約400K 程度の範囲に準安定相、平衡相の生成溶解とは温度 領域が分離した明確な溶解ピークが現れ、その面積 は熱処理時間約1日で飽和した。その飽和値は従来 の報告値と良い対応を示した。この温度での熱処理 によりL1」構造をもつGPゾーンが形成することが報 告されており、長時間熱処理した GP ゾーンでは TEM 観察により明確な L12規則化による規則反射が 観察されている[3]。Al-Li合金でも同様のLl2規則構 造を持つδ'相が形成することが知られているが、 母相との間にほとんど歪を持たないδ'と異なり、 Al-Mg 合金では格子定数差のために組織に異方性が 現れ、結果として TEM 像に100方向に組成変調 が現れることが報告されている[3]。しかし従来の報 告では歪変調によるコントラストの異方性の観察に とどまり、詳細は不明であった。図1は得られた Al-Mg 合金試料の 2 次元小角散乱強度である。なお、 この強度分布は入射 X線エネルギーは1.298keV で あり、MgのK吸収端に近く、Al母相とのあいだの 散乱コントラストが強調される条件となっている。 短時間熱処理ではほぼ等方的なリング状の散乱が観 察されており相分離初期には明確な組織の異方性は 認められていない。一方熱処理時間が3日、2週間 の試料についてみると 100 方位に強い相間が見られ る特徴的な散乱パターンに変化するとともに、散乱 強度が低角側にシフトしている、すなわち組織のス ケールが大きくなっていることが分かる。得られた 散乱強度の 100 方向ならびに 110 方向(45°方向)の 強度プロファイルを比較すると、2 次元強度分布に 明確な異方性が認められる後者 2 つの時効条件でも 慣性半径に方位依存性はなく、散乱強度と GP ゾー ン間の距離に相当する散乱強度のピーク位置がわず かに変化していることがわかった。2次元散乱強度 の測定により、TEM 観察では異方性の存在だけが報 告されていた GP ゾーンの組織情報としてゾーンの 形状自体には異方性は認められないが、ゾーンの配 置に関して弱い 100 方向への配列相間が現れている ことが明らかとなった。

一方、異常分散効果を検討するために Mg 吸収端 から離れた低エネルギー側として 1.26keV から吸収 端直下の1.302keVまでの数点のエネルギーでの散乱 強度の変化を調べたものを図2に示す。異常分散効 果により Mg リッチな GP ゾーンの平均散乱因子が 減少し、吸収端直下で極小となるのに対応して散乱 強度は最低エネルギーで最も弱く、最大(吸収端直 下)エネルギーで最大となっていることが分かる。 また、2元系では(2相モデルの成立する場合は多元 系でも) 散乱強度は単純に母相と析出物 (GP ゾー ン)の平均散乱因子密度の差の2乗に比例するため、 散乱強度はエネルギーの変化に伴って定数倍だけ縦 方向に変化する。 この強度変化の比を使うと、実 験的に本測定での Mg の異常分散項を評価すること が出来るため、散乱強度比から計算した Mg の原子 散乱因子のエネルギー依存性を CromerLibermann に よる計算に従った値の公表値[4]と比較したものが図 3である。図では MgO ナノ粒子の小角散乱強度のエ ネルギー依存性からの計算値も示している。MgOナ ノ粒子による散乱の場合はコントラストが真空と MgO の間の電子密度差であるため、Mg の吸収端に 近づくにつれて逆に散乱強度は弱くなる。しかし図 に示されるように散乱強度比から計算された Mg の 異常分散項かは Al-Mg 合金の小角散乱強度から計算 した結果と良い一致を示しており、本測定では Mg のK吸収端での異常小角散乱測定が正しく測定され たことを示している。なお、通常の硬 X 線の小角散 乱では困難な Al-Mg の小角散乱が吸収端から最も離 れた条件でも観察されているのは、その条件でも図 4から分かるように原子散乱因子は緩やかに変化し 続けているため、硬 X 線と比較するとまだ十分大き いためである、







図2: Al-15Mg時効材のASAXS 強度変化



図 3: ASAXS 強度比から求めた Mgの異常分散効果 と文献値の比較

#### 4 <u>まとめ</u>

MgのK吸収端における異常分散効果を利用した 2次元以上小角散乱測定をおこない、高濃度Al-Mg 合金の低温熱処理に伴い精製するGPゾーンの組織 を評価した。組織の異方性の起源がGPゾーンの形 状異方性によるものではなく、その配列異方性によ るものであることを明らかにした。小角散乱強度の 波長依存性から計算した異常分散項はCromer-Libermannによる報告値と良い対応を示した。

### 謝辞

本実験は科研費基盤研究25286085の補助を受けて 遂行された。

## 参考文献

[1] H.Okuda et al., J. Appl. Crystallgr.49,1803(2016)

[2] H.Okuda et al., Appl. Phys. Express, (2019) accepted, online.https://doi.org/10.7567/1882-0786/ab2a40

[3] T.Sato et al., Metall.Trans. 13A,835(1982)..

[4]http://usaxs.xrays.aps.anl.gov/staff/illavsky/atomicfor mfactor.html

\* okuda.hiroshi.5a@kyoto-u.ac.jp